

# ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

装置名 Device registration name	200kV原子分解能走査透過分析電子顕微鏡 200kV atomic-resolution analytical TEM/STEM
装置ID Local ID	OS-003
大分類 Major category	電子顕微鏡 Electron Microscope
メーカー名 Manufacturer name	日本電子 JEOL
型番 Model number	JEM-ARM200F



## 登録必須ファイル Required registration files

### TEM/STM版 (TEM/STM Version)

以下のいずれかのファイルを投入  
Submit One of the Following Files  
.dm3ファイル (画像/測定条件)  
.dm3 file (Image/Masurement Conditions)  
.dm4ファイル (画像/測定条件)  
.dm4 file (Image/Masurement Conditions)

### 異常終了と表示されたら

If "Abnormal termination" is displayed



## 登録必須ファイルであるか確認してください。

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

## 機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

### 1 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は謝辞をご記載ください。

When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments

### 2 課題利用が終わったら利用報告書をご提出ください。

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

#### 謝辞について

About acknowledgments

<https://nanonet.go.jp/page/page000731.html>

#### 利用報告書について

About user report

<https://nanonet.go.jp/page/page000846.html>

